

**Termin**

26.01.2012 | 09:00 – 16:30 Uhr

**Referentinnen**

Irene Schellner | Europäisches Patentamt, Wien  
Elke Thomä | TU Ilmenau, PATON

**Ziel**

Sie haben Kenntnisse zu Patentrecht und Patentinformation in Japan, China und Korea. Sie kennen die Informationsangebote zu ostasiatischen Schutzrechten der jeweiligen Patentämter und der kostenfreien WEB-Datenbanken DEPATISNET und ESPACENET

**Zielgruppe**

Patentingenieure / Patentmanager, Patentrechercheure

**Voraussetzung**

Kenntnisse zum Patentwesen

**Inhalt**

- **Einführung und Hintergrundinformation**
  - Wachsende Bedeutung der Patentinformation aus dem ostasiatischen Raum?
- **Patentrecht und Patentinformation - Japan, China, Korea**
  - Einige Fakten zum Patentsystem
  - Schutzrechtsarten
  - Merkmale im Erteilungsverfahren
  - Besonderheiten der Patentdokumentation
  - Lesen der ersten Seite eines Patentedokuments
  - Informationsangebote (Datenbanken, Volltexte, Übersetzungen, Rechtsstände, jp. FI- und F-Terms)
  - Recherchebeispiele
- **Patentwesen in Taiwan, Hong Kong und Singapore; kurze Einführung**
- **Recherchieren nach ostasiatischen Schutzrechten in Espacenet und Depatisnet**

**Post**

Technische Universität Ilmenau  
PATON | Landespatentzentrum Thüringen  
Postfach 10 05 65  
98684 Ilmenau

**Veranstaltungsort**

Leibnizbau  
Seminarraum 4026  
Langewiesener Str. 37  
98693 Ilmenau

**Veranstaltungsbeginn**

vormittags: 09:00 Uhr  
nachmittags: 13:00 Uhr

**Ihre Ansprechpartnerinnen**

Frau Elke Thomä  
Tel. +49 3677 69-4507

Frau Joanna Ritschel  
Tel. +49 3677 69-4511

Fax +49 3677 69-4538  
Mail [paton.seminar@tu-ilmenau.de](mailto:paton.seminar@tu-ilmenau.de)  
Web [www.paton.tu-ilmenau.de](http://www.paton.tu-ilmenau.de)

**Gebühren und Bedingungen**

Ganztagesseminar: 195,00 Euro  
Halbtagesseminar: 97,50 Euro

Die Mindestteilnehmerzahl für ein Seminar beträgt 4 Personen, bei Nichterreichen kann das Seminar 5 Tage vor Beginn abgesagt werden. Stornierungen Ihrerseits berücksichtigen wir deshalb nur bis 5 Arbeitstage vorher. Wird eine Anmeldung später zurückgezogen oder erscheint ein Teilnehmer nicht zum Seminar, erheben wir 50 Prozent der Seminargebühren. Für Mitarbeiter und Studierende der TU Ilmenau und anderer Hochschulen gilt die Gebührenordnung des PATON. » [www.paton.tu-ilmenau.de](http://www.paton.tu-ilmenau.de)

**Anmeldung unter**

[paton.seminar@tu-ilmenau.de](mailto:paton.seminar@tu-ilmenau.de)  
mit Angabe von:

- Termin und Seminartitel
- Teilnehmeranschrift mit Telefonnummer und Mailadresse
- Rechnungsanschrift

# PATON SEMINAR

## USA | Ostasien Patentrecht/ Patentinformation

24. – 26. Januar 2012

PARTNER



## US-Patentrecht, US-Patentdatenbanken

### Termin

24.01.2012 | 09:00 – 16:30 Uhr

### Referentinnen

Elke Thomä, Sabine Milde | TU Ilmenau, PATON

### Ziel

Sie haben Kenntnisse zu US-Patentrecht und US-Patentinformation

### Zielgruppe

Personen aus Wissenschaft und Technik, Patentfachleute, Patentrechercheure

### Voraussetzung

Kenntnisse zum Patentwesen, Kenntnisse zur STN-Suchsprache

### Inhalt

- **US-Patentrecht - Hintergrundinformationen für die Durchführung und Auswertung von Recherchen und für das Verstehen von US-Schriften**
  - Schutzrechtsarten
  - Besonderheiten und Änderungen im US-Patentrecht
- **Patentdatenbanken mit Informationen zu US**
  - Datenbanken der Patentämter (USPTO, ESPACENET, DEPATISnet)
  - STN-Datenbanken mit Patentinformation zu US (USPATFULL, USPAT2, USPATOLD, IFIPAT, IFICLS, INPADOCDB, INPAFAMDB, DWPI, CAplus)
  - Dokumentenarten, Nummernformate, und Dokumentenbeispiele
  - Besonderheiten bei Klassifikations-, Namens- und Rechtsstandsrecherchen
  - Recherchebeispiele
  - Klassifikation und Kommentierung

## U.S. Patent Litigation - Ein Wegweiser für die Praxis

### Termin

25.01.2012 | 09:00–12:30 Uhr

### Referent

Rechtsanwalt Dr. Tobias Wuttke | MEISSNER BOLTE Patent- und Rechtsanwälte, München

### Ziel

Sie haben Kenntnisse über Kernfragen des US-Patentverletzungsprozesses (z.B. Kosten, Dauer, Verfahrensablauf, Schutzbereichsbestimmung, Schadensersatz). Sie kennen praktische Konsequenzen, die sich aus diesen amerikanischen Besonderheiten für Patentinhaber sowie diejenigen, die wegen Verletzung eines US- Patents angegriffen werden, ergeben

### Zielgruppe

Leiter sowie Mitarbeiter aus den Bereichen F&E, Gewerblicher Rechtsschutz, Patente, Recht sowie interessierte Patent- und Rechtsanwälte. Darüber hinaus sind auch Personen aus dem Bereich Forschung & Lehre angesprochen.

### Voraussetzung

Erste Grundkenntnisse zum Patentrecht

### Inhalt

- **Wie vermeidet man einen U.S.- Patentverletzungsprozess?**
- **Vorprozessuale Überlegungen (Kosten, Dauer, Verfahrensablauf, Rechtsmittel)**
- **Das Verletzungsverfahren: Simultane Bewertung von Nichtigkeit und Verletzung**
- **Die Bestimmung des Schutzbereichs eines US-Patents**
- **Was kostet eine Patentverletzung in den USA - mit welchen Schadensersatzansprüchen ist zu rechnen und wer bestimmt die Schadenshöhe?**
- **Das U.S. Discovery-Verfahren (insbesondere e-Discovery): Sachliche und territoriale Reichweite**
- **Der U.S.-Patentverletzungsprozess als strategisches Mittel**

## Ostasiatische Patentpublikationen - Herausforderung für Datenbankanbieter und Rechercheure

### Termin

25.01.2012 | 13:00–16:30 Uhr

### Referentin

Elke Thomä | TU Ilmenau, PATON

### Ziel

Sie kennen Quellen ostasiatischer Patentinformation bezüglich Qualität und Quantität und kennen Strategien für die professionelle Nutzung des Online-Dienstes STN-International mit Mehrwertdatenbanken und komfortablen Recherchemitteln, um effiziente Rechercheergebnisse zu erzielen

### Zielgruppe

Patentrechercheure, Patentingenieure / Patentmanager

### Voraussetzung

Kenntnisse zur STN-Retrievalsprache und zu den STN-Patentdatenbanken

### Inhalt

- **Herausforderungen an Datenbankhersteller und Rechercheure**
- **Japan, China, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore: Schutzrechtsarten, Abdeckung, Aktualität**
- **INPADOCDB/INPAFAMDB, DWPI, CAplus, JAPIO, KOREAPAT**
- **Text-, Klassifikations-, Nummern- und Namensrecherchen**
- **Recherchestrategien in Mehrwertdatenbanken**